

# H30年度導入 ものづくりを支援する最新装置 波長分散型蛍光X線分析装置

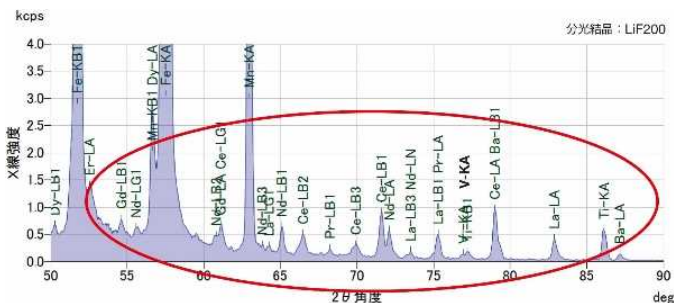
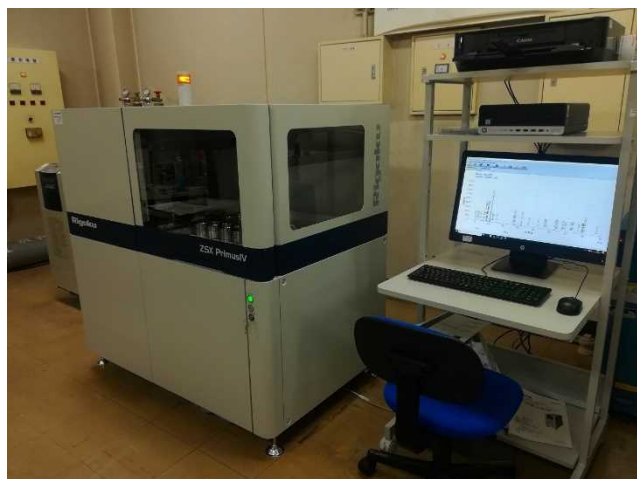
WD-XRF: Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer

## 【装置概要】

試料に含有されている元素の種類と量を調べる装置です。試料にX線を照射したときに試料から放出される特性X線（蛍光X線）を検出することで分析します。

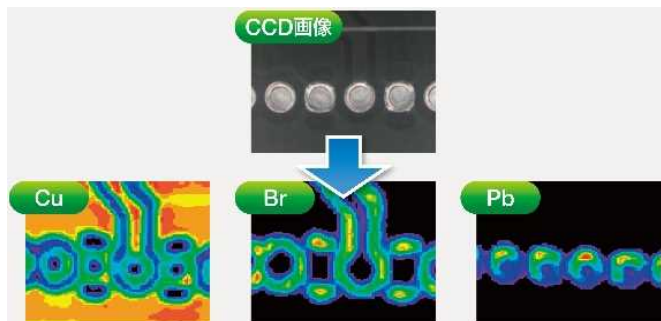
## 【特徴】

- **多彩な試料が測定可能**  
扱いやすい固体だけでなく、粉体や液体も適切な前処理をすることで測定可能です。
- **前処理が容易**  
溶液化、金属の蒸着等の前処理を必要とせず、非破壊で簡単に測定可能です。
- **高い元素分解能**  
分光結晶を8種取揃え、様々な元素を検出できるとともに、ピークを明瞭に分離できます。(測定例1)
- **ピンポイント分析**  
CCDカメラで測定位置を確認して分析できます。線分析、マッピング分析も可能です。(測定例2)



ピークが明瞭に分離されています。

測定例1：岩石試料の測定



元素の有無が色の違いで表示されます。

測定例2：電子基板のマッピング分析

## 【主な仕様】

製造者	株式会社リガク
型式	ZSX Primus IV
X線照射方式	上面照射方式

最小測定径	0.5mm
検出可能元素	Be(ベリリウム) ~ U(ウラン)
X線管球	Rhターゲット 4kW